



Kraftmikroskopie (AFM)

Messgrößen

- Oberflächenprofil von ebenen Materialien wie Optiken

Prinzip

Abrasterung von Oberflächen nach dem Prinzip der Kraftmikroskopie

Anwendung

Untersuchung der Feinstruktur von Oberflächen mit nm Auflösung

Kontakt

- Gabriele Taube, Institut für Technische Physik, Tel: +49 711 6862 286, Fax: +49 711 6862 788
- Oliver Miedaner, Technologiemarketing, Tel: +49 711 6862 284

Dieses Handout sowie Querverweise zu verwandten Messtechniken und Anlagen finden Sie unter: <http://messtec.dlr.de/link-515-de>.